Work report

1. Force for TEST\_\* Z status， it is not effect; 再sujie把ANA中4个TEST信号放开后，TB从PAD上灌激励已实现此4TEST信号全覆盖。
2. EN\_CHIP\_V33信号之前测试的是PAD口到\_ANATOP, 现在是从芯片的顶层RSTN到ANATOP层。测试已经**PASS**！
3. ANA-DIG文件整理。
4. Coverage统计分析。提高覆盖率，修改IOMUX文件，更新脚本。
5. 检测testmode没有功能的PAD口为Z态。